Search Notes



Appli	cat	ion/	Con	trol	No.
-------	-----	------	-----	------	-----

Applicant(s)/Patent under Reexamination

10/700,466 Examiner OHMI, TADAHIRO
Art Unit

Thien F. Tran

2811

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
257	347, 374 410, 411 501, 506 510	4/2/2006	П	
257	325	4/2/2006	π	
		•		

INTERFERENCE SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
		•	
•			
		·	
	<u> </u>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	1		
·			
		:	